

Model

AX-3245A 5分类数位电容检测计

适用于铝电解电容的老化制程之检查



- 搭载接触检知(CONTACT CHECK)功能
- 测定频率: 120Hz
- 测定时间: 总和测定时间 约105msec. (含接触及残留电压检知时间约27msec.+稳定时间45msec.)连续测定时约3回/秒
- 搭载数字比较器显示, 输出5分类判定
- 数据输出:Centronics(标准)

Specifications

测定测定范围及准确度(周围温度23°C±5°C)※D<1 串联等价回路

测定档位	400nF	4 μF	40 μF	400 μF	4mF	40mF
C准确度	±0.5%±2(digit)					1%±5(digit)
tan δ 准确度	± $\left(\frac{\tan \delta (\text{digit}) \times 0.3}{100} + 2 + \frac{2000}{C \times (\text{digit})} \right)$ digit					± $\left(\frac{\tan \delta (\text{digit})}{100} + 5 + \frac{2000}{C \times (\text{digit})} \right)$ digit
测定模式	串联等价回路					

※tan δ 为100.0%~199.9%时, C与tan δ 的准确度为上述数据的2倍。

测定模式	串联等价回路
测定信号位准	400mV(r.m.s.)以下
测定方式	信号施印加二端点、信号检出二端点、遮护端点构成五端点
测定频率	120Hz±0.1%以内
测定端点	前面面板部:五端点 背面板部:8P圆型金属连接界面
接触检知	输入端点有一个端点以上且约200Ω以上接触电阻检测出时,发出测定错误之功能
输入保护	于四端点接触,测定试料的未放电电压检测出约2.2V以上时,保护测定回路之功能(残留电压检知)
测定时间	[HOLD模式测定时间] 约105msec. (接触检知 & 残留电压检知) 约27msec. (测定稳定时间) 约45msec. (至测定端点开放为止) 约96msec. [Free Running模式测定时间] 约3次/秒
比较器设定范围	容量C: LL、L、H、HH 4点“200~3999” 损失tan δ : “1~199.9”
比较器判定方式	数字元数据比较方式
判定结果显示	容量: CLO、CLG、CGO、CHG、CHI tan δ : DGO、DNG TOTAL: C/D-GO
判定结果外部输出	GO1、GO2、CNG、DNG
控制信号	输入: START、HOLD、RESET、CINH、SHIFT、NINH、GINH 输出: GO1、GO2、CNG、DNG、CER、COV、DER、DOV、CEND、MEND、BUSY、SLCT、CCE、VCE、各种SHIFT判定
使用周围环境	温度: +5°C~+40°C、湿度: 80%以下(于水气凝缩状态下不可使用)
电源需求	AC100V~240V切换、50/60Hz、约45VA
外观尺寸	约432(W) × 149(H) × 450(D)mm (不包含橡胶垫等凸出物)
重量	约12kg

Remarks

※本制品为订制商品

Option